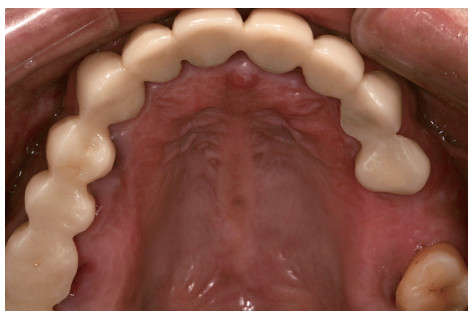
이훈재 원장 지·상·강·좌

Scan Abutment를 이용한 Multiple 임플란트 임상 적용

Clinical Case 1. 하악 양측 구치부에 3unit 임플란트


그림1. 상악의 교합면 모습으로 Temporary restoration 상태이다.

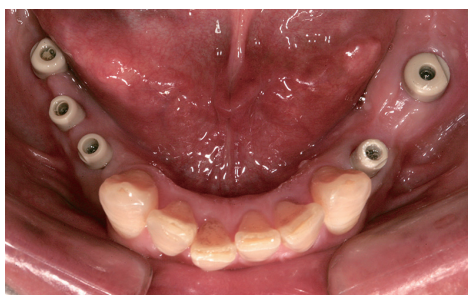

그림2. 하악의 이차 수술 후에 Scan Abutment를 연결하였다.


그림3. 수직 고경은 상, 하악 전치부에서 형성이 되어 있기 때문에, 그 상태에서 바이트를 채득하면 된다.

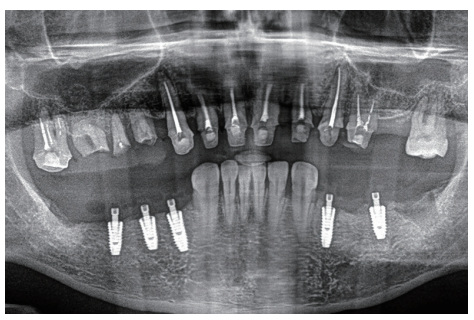
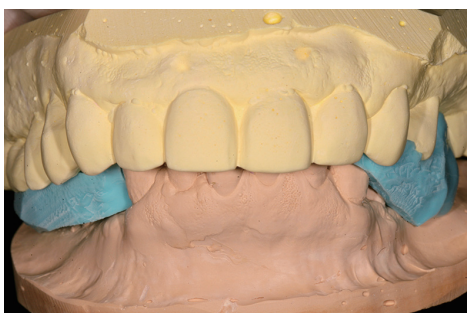

그림4. 연결된 상태를 확인하는 방사선 사진이다.


그림5. 하악의 인상을 채득한 모습이다.


그림6. 제작된 작업 모형의 모습.


그림7. 모형 상에 교합을 채득한 바이트를 위치시켰다. 만약 수직 고경을 높이고 싶다면, 전치부에 jig나 leaf gauze를 이용하여 수직 고경을 높여서 바이트 채득을 하면 된다.

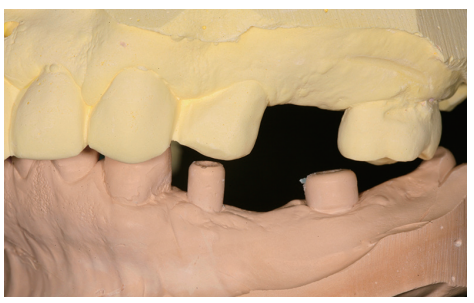

그림8. 협측에서 본 모습으로, 대합치와 닿지 않는 범위 내에서 Scan Abutment를 선택한다.


그림9. 반대편의 협측 모습.

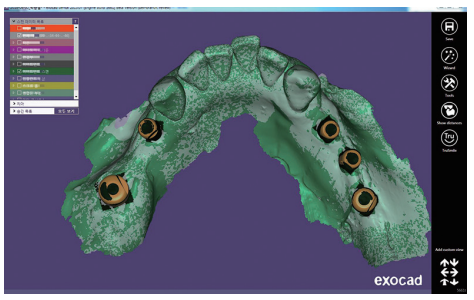


그림10. 모델 스캐너를 사용하여 스캔한 하악 작업 모형이다.

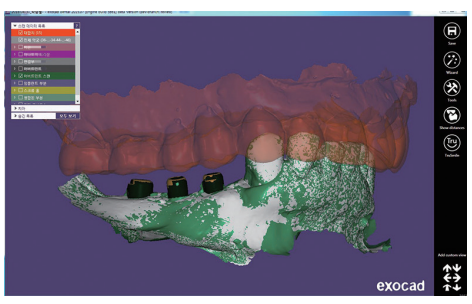


그림11. 우측 협면에서 본 모습.

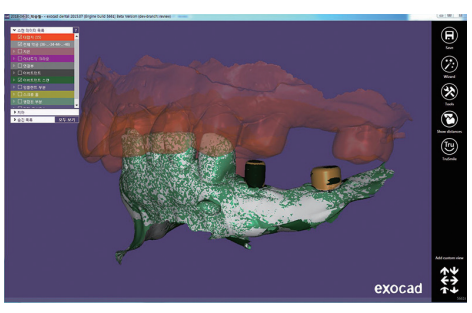


그림12. 좌측 협면에서 본 모습.

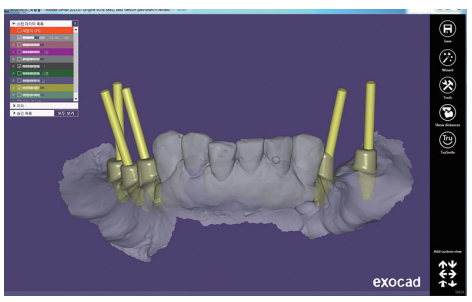


그림13. Customized Abutment를 설계하는 과정이다.

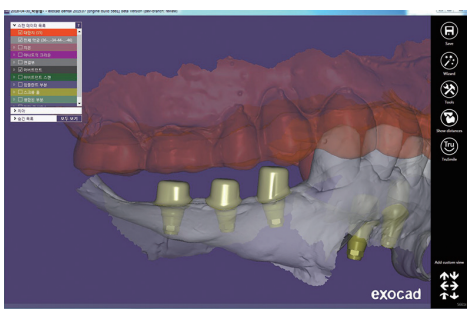


그림14. 디자인이 완성된 우측의 Customized Abutment의 모습.

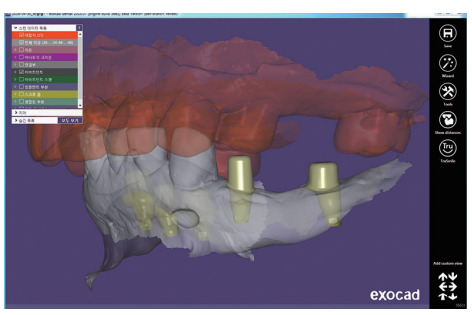


그림15. 디자인이 완성된 좌측의 Customized Abutment의 모습.

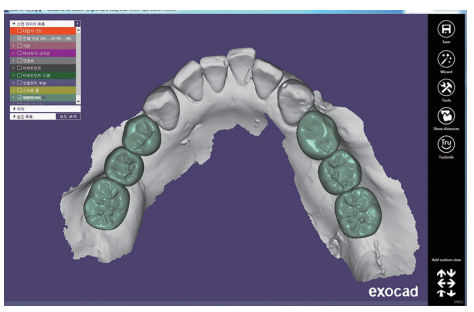


그림16. Temporary restoration 디자인을 마친 모습.


그림17. 완성된 환자 좌측부의 Customized Abutment와 Temporary restoration의 모습.


그림18. 완성된 환자 우측부의 Customized Abutment와 Temporary restoration의 모습.